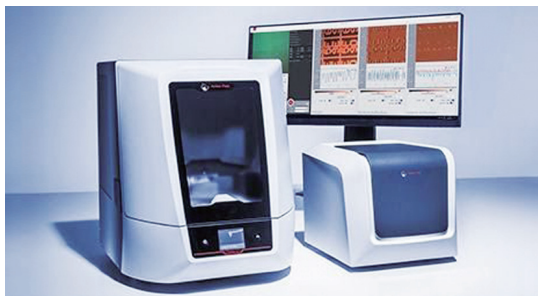




奈米材料表面特性分析的首選 安東帕智慧型原子力顯微鏡—Tosca 400

原子力顯微鏡(Atomic-Force-Microscope; AFM)提供可重複、定量和快速的次奈米等級表面粗糙度測量。對於許多任務，AFM是唯一能提供所需準確性的技術。使用Tosca 400可在較寬動態範圍內測量表面粗糙度，並結合三維資訊獲得定量的結果。利用測量結果評估沉積材料附著力及電晶體閘極堆疊中介面的可再現性，同時出色的控制電觸點（例如源極、漏極和閘極觸點）及晶圓背面功率電子器件（例如 IGBT）的品質。

專利的智慧型功能涵蓋了AFM測量程序的每個步驟，創造了一個獨特的、高度簡化的 AFM 工作流程，其結果比傳統AFM系統快10倍，僅需1小時即可開始測量。在幾秒鐘內快速、安全的懸臂加載、自動雷射對準、最直觀的樣品導航和市場上最安全的參與程式將引導您實現您的目標：有更多的時間專注於您的研究成果。



原子力顯微鏡-Tosca 400的優勢

- ◆ 最大的樣品台（晶圓最大200 mm）
- ◆ 最快的測量時間（僅3分鐘）
- ◆ 最高級別的硬體和軟體自動化

關於台灣安東帕

Anton Paar於2019成立台灣分公司。我們在密度測量、濃度測量、溶解二氧化碳測定、流變儀以及黏度測量均為全球領導地位品牌。客戶群包括全球知名的啤酒和軟性飲料製造商，除了飲料產業外我們客戶群也包含了食品業、化學品、半導體產業、製藥產業和石化工業。公司自從創立以來致力於高精密製造並結合最新的科學技術研發，目前提供約170種分析方法來協助客戶改善製程提高研發能量。Anton Paar總公司位於奧地利格拉茲，集團活躍於110 多個國家，全球有32家銷售分公司以及9個分布於歐洲和美國的生產基地，提供最專業及高品質的服務支援。■

廠商聯絡資訊

台灣安東帕有限公司

電話：+886-2-8979-8228 信箱：info.tw@anton-paar.com

深入了解詳情：

安東帕智慧型原子力顯
微鏡—Tosca 400

